

## EML T0 老化测试系统

### PSS EMLBI21536/EMLBI11536



## 产品简介

### PRODUCT INTRODUCTION

普赛斯 EML T0 集成式老化测试系统 用于 EML T0 器件的老化筛选以及可靠性寿命分析。系统支持最大 1536 路器件老化，通过外部环境控温或对器件内部 TEC 进行高温控温，为 LD 器件提供恒定电流来实现对 EML 器件的老化，系统可实时显示老化电流、背光电流、正向电压、EA 电流等参数并且图形直观显示，便于用于观察老化过程中的异常情况，通用老化板兼容我司 EML T0 盘测系统，显著提高测试效率和 T0 产品质量。

## 产品应用

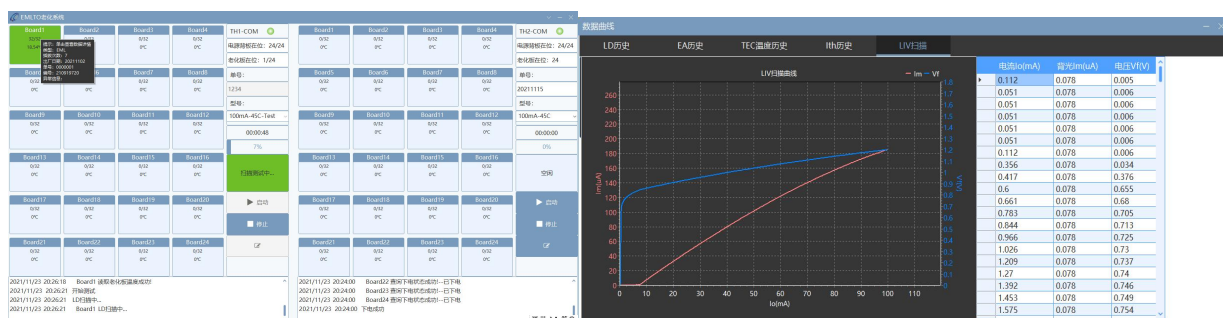
### PRODUCT APPLICATION

- 批量生产环节中 EML T0 器件进行老化筛选
- 长时间可靠性失效测试分析

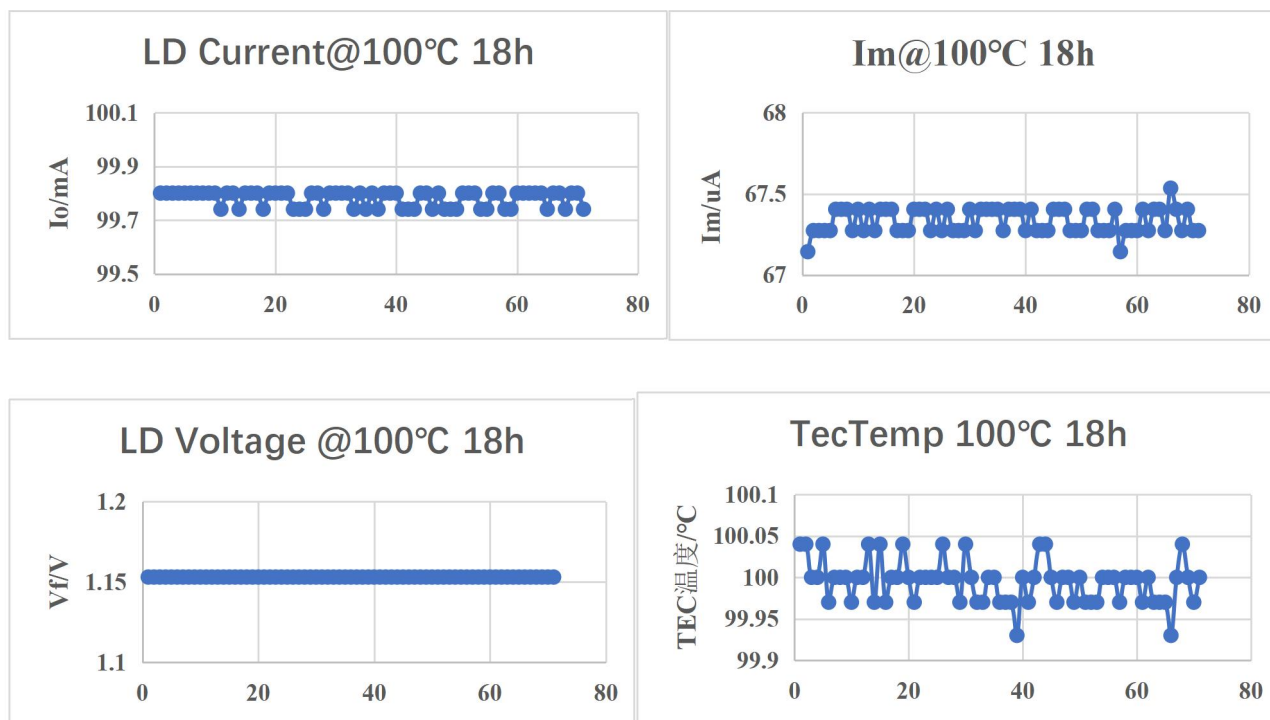
## 产品特点

### PRODUCT FEATURES

- 硬件支持 SOA 供电，完美兼容带 PD 或 SOA 的 EML 激光器
- 支持 Im 扫描计算 lth



- 32 路老老板作为通用载体，可以实现盘测、老化不同工位直接的转料，提高生产效率
- 每块老老板可配置不同参数进行老化，老化参数稳定可靠



- 支持热插拔，完善的 EOS 防护，保证器件老化期间安全



## 技术参数

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

参数	指标
老化规模	1536
LD 驱动电流	0~250mA
SOA 驱动电流	0~250mA
PD 反偏电压	0~5V
LD 正向电压	0~5V
LD 监控电流	0~250mA
SOA 监控电流	0~250mA
PD 监控电流	0~2000uA
EA 电压	0~-5V
EA 电流	0~200mA
LIV 扫描	支持 Im 扫描计算 Ith
温控方式	支持外部环境控温和 TEC 控温
TEC 电流范围	-1A~+1A
温控范围	环境温度控温: RT+20°C~150°C 器件内部 TEC 控温: RT~130°C
温度稳定性	±0.5°C
数据库	系统自带 SQL 数据库, 可以追述保存 LD 测试的数据
电源规格	AC 380V/50HZ
功率	AC 380V 7000W